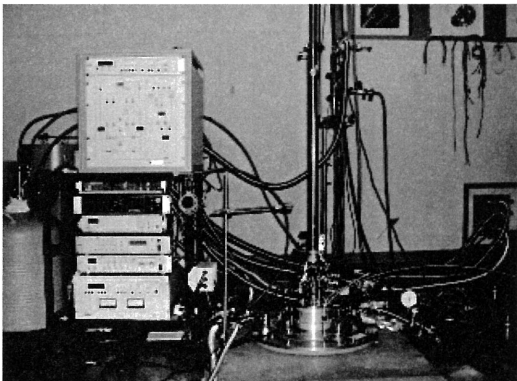
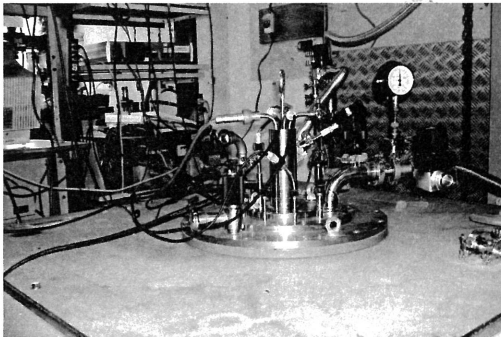


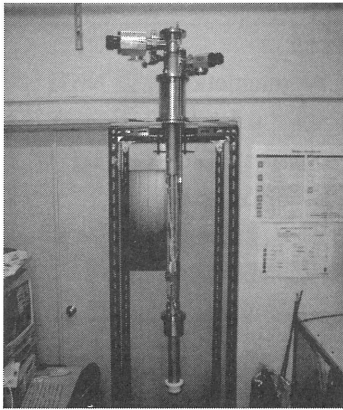
## センターからのお知らせ

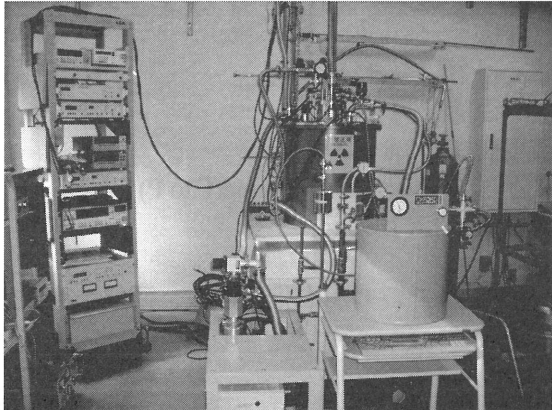
### 共同研究、共同利用設備一覧

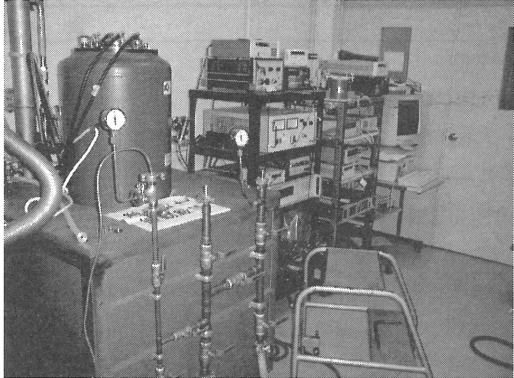
極低温科学センターでは、共同研究、共同利用実験のため、実験室に以下のような装置を提供しております。ここで「共同研究設備」とは本センター職員と共同で行う研究用の実験装置、「共同利用設備」とは基本的に利用者のみで実験を行う装置です。共同利用の装置は共同研究として使用することも可能です。共同研究および共同利用の申込法、マシンタイム、装置の詳しい性能等に関しましては、極低温科学センタースタッフ（極低温物理学部（青葉山）：内線 6476、低温科学部（片平）：内線 2167、ホームページ <http://www.clts.tohoku.ac.jp/index.html>）にご相談ください。また装置に関係なく低温技術に関する相談にもできる限り応じております。どうぞお気軽に連絡ください。

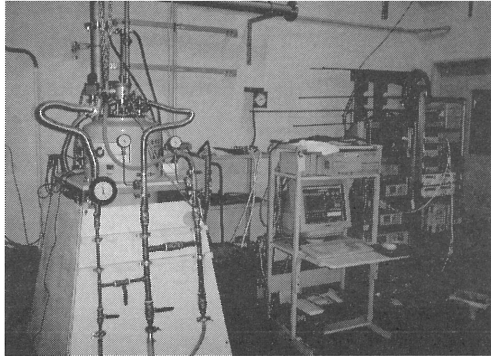
装置名	場所	分類
トップローディング式希釈冷凍機システム	極低温物理学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 形式：トップローディング方式 試料空間径：20 mm 最低到達温度：20 mK 最高磁場：17 T プローブ：試料回転装置付プローブ 圧力用プローブ  常圧、静水圧、一軸圧下で電気抵抗などの輸送現象、AC 帯磁率、dHvA 効果などの測定が可能です		

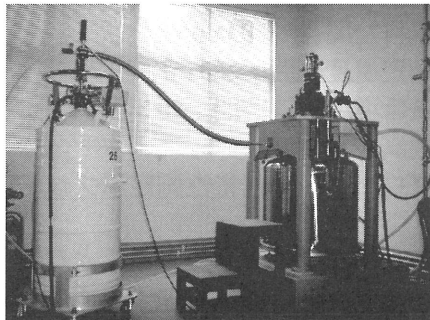
装置名	場所	分類
温度可変インサート&10T 超伝導マグネットシステム	極低温物理学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 温度可変範囲：1.2K-300 K 試料空間径：30 mm 最大磁場：10 T  磁気抵抗と AC 帯磁率の測定が可能です。		

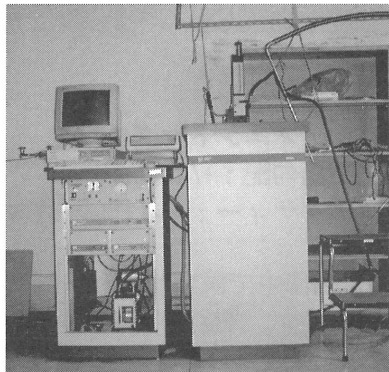
装置名	場所	分類
$^3\text{He}$ クライオスタットインサート	低温科学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 試料空間口径：25mm $\phi$ 最低到達温度：340 mK (ワンショット運転) 530 mK (連続運転) 最低温度到達時間：1.5K より 2時間  低温科学部にある 9/11T 超伝導マグネット、およびファラデー型超伝導マグネットに挿入可能な自作の $^3\text{He}$ 冷凍機です。トップロードニングとバキュームロードニングの両方の形式で実験が行えます。現在、磁場中輸送特性とファラデーセルを用いた DC 磁化測定が可能です。		

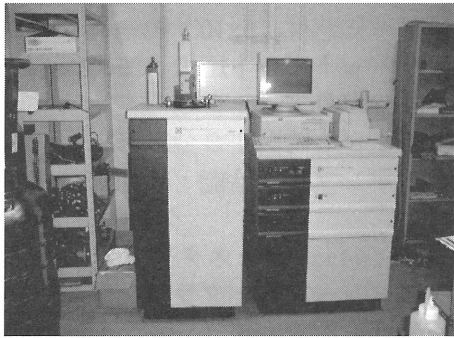
装置名	場所	分類
トップロードニング式 $^3\text{He}$ クライオスタットシステム	低温科学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 Oxford 社 Heliox-TL 形式：トップロードニング方式 試料空間径：38 mm 測定温度範囲：260 mK 最低温度保持時間：50 h 以上 最高磁場：8 T プローブ：輸送特性測定用プローブ  装置をウォームアップすることなく、試料の交換が簡単にでき、かつ数時間で室温から最低温度に達することのできる便利なクライオスタットです。		

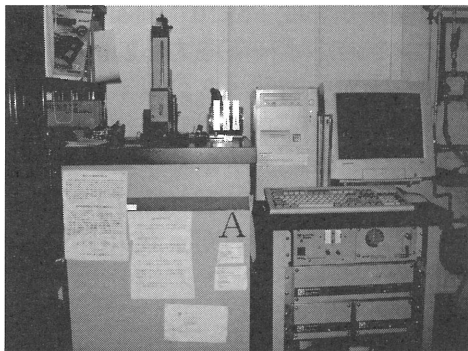
装置名	場所	分類
ファラデー型超伝導マグネット	低温科学部	共同研究
装置の説明		
装置仕様 a. バックグラウンドマグネット 均一度：0.1%/cm 最大磁場：8T 口径：63.5mm $\phi$ b. グラディエントマグネット 最大磁場勾配：+/-6 T/m リニアリティ：+/-0.1%/cm DSV  1-8T の磁場中で試料空間に一定の磁場勾配を作るマグネットです。 $^3\text{He}$ クライオスタットインサートと組み合わせて磁化と電気抵抗、VTI (1.5-300K) と組み合わせて電気抵抗が測定可能です。		

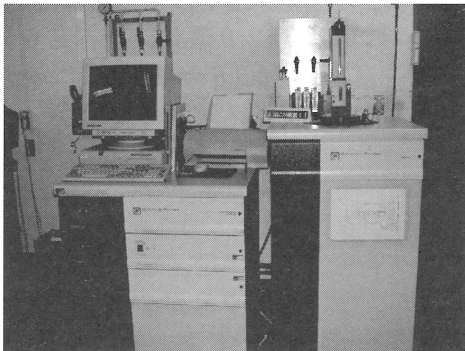
装置名	場所	分類
温度可変インサート&9/11T 超伝導マグネットシステム	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>a. Cryomagnetics 社製 NbTi マグネット  均一度：0.1%/cm (磁場安定性 1ppm/時間)  最大磁場：9T/11 T (11 T はラムダプレート使用時)  口径：63.5mm φ</p> <p>b. VTI (温度可変型インサート)  試料空間口径：45mm φ  温度可変領域：1.5K-325K (安定度 0.1K)</p> <p>磁場中輸送特性が測定可能です。</p>		
		

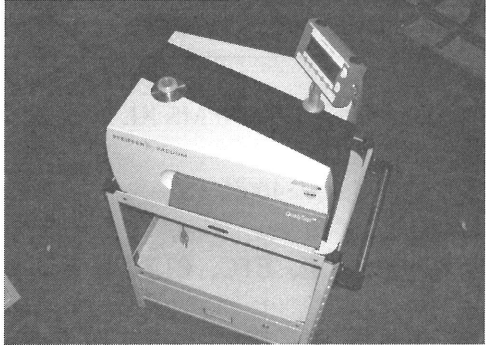
装置名	場所	分類
VSM 磁化測定装置	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>Oxford 社 MagLab<sup>VSM</sup>  最大磁場：14 T  温度範囲：3.8-300 K  ノイズレベル：<math>2 \times 10^{-6}</math> emu(P to P)  分解能：<math>1 \times 10^{-8}</math> emu</p> <p>最大 14T までの DC 磁化の温度、磁場依存性が自動測定できます。</p>		
		

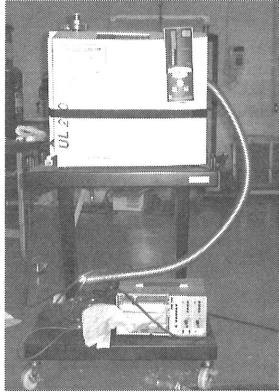
装置名	場所	分類
SQUID 磁化測定装置-1	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>Quantum Design 社 MPMS<sub>2</sub>  最大磁場：1 T  温度範囲：1.7-350K  分解能：<math>1 \times 10^{-8}</math> em</p> <p>1T までの DC 磁化の温度、磁場依存性が自動測定できます。</p>		
		

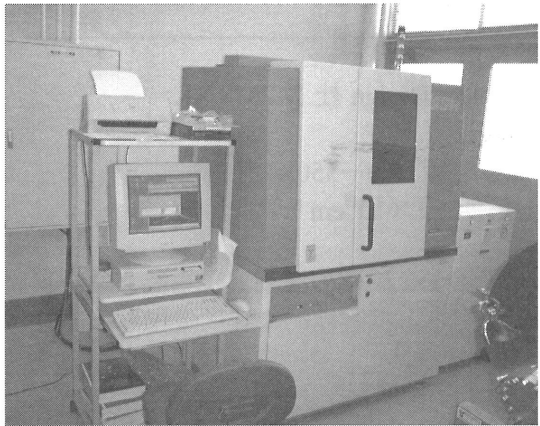
装置名	場所	分類
SQUID 磁化測定装置-2	低温科学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 Quantum Design 社 MPMS XL 最大磁場：7 T 温度範囲：1.7-400K 分解能： $1 \times 10^{-8}$ em RSO、AC 測定、ETC、CLTC オプション付  7T までの DC、AC 磁化の自動測定がきます。 4.2K をはさんで連続的に温度変化も可能です。		

装置名	場所	分類
SQUID 磁化測定装置-A	極低温物理学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 Quantum Design 社 MPMS <sub>2</sub> 最大磁場：1 T 温度範囲：2.2-350K 分解能： $1 \times 10^{-8}$ em  1T までの DC 磁化の温度、磁場依存性が自動測定できます。		

装置名	場所	分類
SQUID 磁化測定装置-B	極低温物理学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 Quantum Design 社 MPMS XL 最大磁場：7 T 温度範囲：2.0-350K 分解能： $1 \times 10^{-8}$ em  1T までの DC 磁化の温度、磁場依存性が自動測定できます。 4.2K をはさんで連続的に温度変化も可能です。		

装置名	場所	分類
リークディテクター	極低温物理学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 PFEIFER 社 Quality Test HLT260 真空およびスニファーモードでの検出可能 最高検知感度： $5 \times 10^{-13} \text{ Pa m}^3/\text{S}$ インレットポート圧力：2500Pa 以下 立ち上がり方式：自動 立ち上がり時間：3分以下 内蔵ポンプ排気性能：補助ポンプ $3.9 \text{ m}^3/\text{h}$ ターボ分子ポンプ 70 l/s 重量：44 kg キャスター付 ディスプレー方式：グラフィック		

装置名	場所	分類
リークディテクター	低温科学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 LEYBOLD 社 UL200 真空およびスニファーモードでの検出可能 最高検知感度： $5 \times 10^{-11} \text{ mbar} \cdot \text{l/s}$ インレットポート圧力：2 mbar 以下 立ち上がり時間：3分以下 内蔵ポンプ：ロータリーポンプ ターボ分子ポンプ 排気性能：1 l/s 以上 (FINE) 0.3 l/s 以上 (GROSS) 重量：32 kg キャスター付		

装置名	場所	分類
試料評価用 X線回折装置	低温科学部	共同利用
装置の説明		
装置仕様 リガク社 RINT2100PC 最大出力：2kW (60 kV、50mA) 封入管式ターゲット ゴニオ部： $\theta/2\theta$ 運動、 $\theta$ 、 $2\theta$ 単独 (範囲： $2\theta = -60 \sim 158^\circ$ 精度： $0.002^\circ$ ) アライメント自動調整、 自動可変スリット モノクロメータ カウンタ：NaI シンチレータ (700000cps 以上) オプション：薄膜用回転試料台 ラウエカメラ (ポラロイドフィルム) 解析：自動ピークサーチ、多重ピーク分離、 定性分析 (PDF2 カード) 結晶系決定、格子定数精密化等		

装置名	場所	分類
走査型 SQUID 顕微鏡	低温科学部	共同利用
装置の説明		
<p>装置仕様</p> <p>セイコーインスツルメンツ (株) SQM200</p> <p>温度範囲：2-90 K</p> <p>センサーコイル径：10 <math>\mu\text{m}</math></p> <p>空間分解能：2 <math>\times</math> 2 <math>\mu\text{m}^2</math> 程度</p> <p>試料表面の磁化 (磁気) 分布測定が可能です。</p>		